Г.И. Костюк, д-р техн. наук, К.П. Исяк, О.О. Бруяка

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР В ОБЪЕМЕ ДЕТАЛИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ

Введение

Для получения нанокристаллических структур на поверхности, как известно, необходимо создание определенных температур (или скорости ее нарастания), давлений в необходимом объеме и наличия атома металла, вокруг которого формируется наноструктура.

Как показано в работах [1-10], действие заряженных частиц на конструкционные материалы приводит к появлению на глубине довольно высоких температур, при действии индивидуальных ионов разных сортов и зарядности и электронов в зоне теплового воздействия есть вероятность появления температурных напряжений значительной величины, что подтверждает возможность появления локальных зон, где достигаются условия появления наноструктур. Для того чтобы такие условия реализовались в значительном объеме: действие высоких температур и напряжений также необходимо обеспечить максимальное заполнение объема полями температур с повышенными температурами и в то же время сохранить зоны с максимальными градиентами температур, когда реализуются высокие значения температурных напряжений. Очевидно, простым увеличением плотностей ионного и электронного тока этого достичь будет нельзя, так как с ростом плотности тока градиенты температур в зоне действия соседних частиц снижаются, а, следовательно, снижаются величины температурных напряжений и условия образования наноструктур не выполняются.

выполнялась рамках программы Работа в Министерства образования и науки "Новые и ресурсосберегающие и технологии в промышленности агропромышленном энергетике. И комплексе" (подсекция 13 – "Аэрокосмическая техника и транспорт") и по темам "Создание физико-технических основ повышения качества материала аэрокосмических конструкций" и "Разработка технологических основ интегрированных технологий плазменно-ионной обработки деталей аэрокосмической техники", а также в рамках хоздоговорных работ и договоров о сотрудничестве.

Состояние вопроса

В работах [16-19] исследовано влияние размера зерна на физикомеханические и электрические свойства материалов, так в работах [16-18]обнаружено наличие максимума микротвердости в зависимости от размера зерна.. В работе [17] наблюдалось слабое влияние размера зерна на микротвердость нитрида в магнетронных нанокомпозитах nc – TiN/αSi₃N₄ при различных температурах отжига, тогда как для вакуумнодуговых нанокомпозитов есть размеры зерен, для которых реализуется максимальная микротвердость рис. 1 - 4.

В работах [1-5] получены высокие значения микротвердости для покрытия 0.8ZrN+0.2HfN при комбинированной обработке до 45 ГПа, повышение износостойкости и стойкости режущего инструмента до 20 раз, а при нанесении только покрытия 0.8ZrN+0.2HfN микротвердость составляла около 35ГПа, что превышает микротвердость отдельных более 2 компонентов чем В раза, все ЭТО дает возможность предполагать, что даже при нанесении только покрытия реализуется появление наноструктур, тогда как дополнительная электроннолучевая модификация позволит получать более эффективные наноструктуры с улучшенными свойствами и на значительной глубине (до 1 мм).



Рисунок 1 – Зависимость микротвердости от процентного состава TiN в покрытии TiB2+TiN (размер кристаллов 3-10,2нм)



размера зерна по данным работы [19]



Рисунок 2 – Микротвердость покрытия в зависимости от размера кристалла [17]



Рисунок 4 – Зависимость микротвердости от размера зерна по данным работы [19]



Рисунок 5 – Зависимость микротвердости Hv от размера зерна дисперсных фаз, выделяющихся в нанокристаллических сплавах, получаемых кристаллизацией аморфных сплавов: 1-Fe_{73.5}Cu₁Nb₃Si_{13.5}B₉; 2 – Fe₈₁Si₇B₁₂; 3 – Fe₅Co₇₀Si₁₅B₁₀; 4- Pd₈₁Cu₇Si₁₂ [16]

За счет действия ионов различных сортов, энергий, зарядности и электронов и их плотностей токов есть возможность сохранения достаточных температур (за счет соответствующего распределения температур по глубине обеспечивается высокая средняя температура), в то же время, выбирая расположение по глубине (варьируя энергии, зарядности и сорта ионов и электронов) обеспечиваем высокие градиенты температур. Следовательно, в довольно большом объеме материала будут действовать значительные по величине напряжения, т.е. будут выполняться условия для получения нанокристаллических структур.

Поэтому, несколько модернизировав модель действия индивидуальных частиц на конструкционные материалы [1,10] получим модель, учитывающую необходимые факторы (в частности, в модели не учитывалась зарядность иона и характер их сложного взаимовлияния в довольно большом рассматриваемом объеме) и одновременное действие электронов.

1. Модель действия индивидуального иона и электрона на конструкционный материал

Взаимодействие потоков заряженных частиц и плазменных потоков материалами связано с реализацией широкого с конструкционными теплофизических, столкновительных, круга процессов: термомеханических термоусталостных, диффузионных, время термохимических И плазмохимических, HO В настоящее отсутствуют работы, учитывающие эти факторы и, тем более, их взаимосвязь. Все эти процессы влияют как на характер теплообмена в объеме детали, так и на поверхности, поэтому учет этих процессов необходим как В балансе энергии элементарном объеме В металлической мишени, так и в теплообмене на поверхности мишени, т.е. в граничных условиях.

1.1. Баланс тепла в элементарном объеме детали

Изменение количества тепла в единичном объеме (первое слагаемое в левой части равенства) реализуется за счет: перемещения потока частиц вдоль обрабатываемой поверхности или перемещения мишени относительно потока плазмы со скоростью Vn (второе слагаемое), теплофизических процессов: влияние на теплообмен

скорости распространения тепла (третье слагаемое), конечной теплопроводности (первое слагаемое справа), смещения фронта (второе слагаемое), плавления слагаемое); испарения (третье столкновительных процессов: объемного источника тепла за счет действия частицы (четвертое слагаемое), затраты энергии на смещение (пятое слагаемое); термоупругих, термопластических атомов И термоусталостных процессов, определяющих энергию деформирования материала элементарного объема (шестое слагаемое); диффузионных теплоперенос процессов, определяющих диффундирующим термохимических материалом (седьмое слагаемое); процессов, связанных с реализацией химических реакций между материалом мишени и бомбардирующими ионами или же между компонентами сплавов и композитных материалов (восьмое слагаемое) и ленцджоулев нагрев за счет растекания тока (девятое слагаемое - для ионного и электронного потоков) и энергия кристаллизации (последнее слагаемое).

$$C[T] \cdot \gamma[T] \frac{dT(x, y, z, t)}{dt} + C[T] \cdot \gamma[T] \frac{\partial T(x, y, z, t)}{\partial y} \cdot V_n + + C[T] \cdot \gamma[T] \cdot \tau_p \frac{d^2 T(x, y, z, t)}{dt^2} = \nabla \lambda[T \cdot \nabla T](x, y, z, t) + + C[T] \cdot \gamma[T] \cdot V_{\text{TM}} \frac{\partial T(x, y, z, t)}{\partial x} - - A \cdot L_{\star} \cdot \gamma[T] \frac{dV_{\star}}{dt} + B \cdot j_{i,e} \cdot \mu_{i,e} \frac{\partial E_{i,e}}{\partial x} - E_{\dots M} \cdot S_{\dots M} \frac{j_{i,e}}{\lambda_{cpie}} \pm \pm D \frac{dW(x, y, z, t)}{dt} \pm m_a \cdot C_a[T_a] \frac{dn_a}{dt} (T_a - T(x, y, z, t)) \pm \pm P_{T,X_{\star}}(n_A, n_B, T, t_{e_{\star}}) \frac{dn_{A(B)}}{dt} L_{T,X,P} + \rho[T] \cdot j^2(x, y, z, t)$$

$$(1)$$

где C[T] и ү[T] – теплоемкость и плотность материала мишени, соответствующие температуре T;

т_р – время релаксации температуры на один Кельвин;

V_n – скорость перемещения плазменного, электронного или ионного потока или мишени относительно него;

L_{пл} и L_{т.х.Р} – удельные теплота плавления и термохимической реакции;

V_ф[T] – скорость смещения фронта испарения;

V_{пл} – объем расплавленного металла;

j_{i,e} – плотность тока ионов, электронов или плазменного потока;

µ_{i,e} – коэффициент аккомодации иона и электрона;

 $\partial E_{i,e}$

д – потери энергии иона и электрона на глубине мишени;

Е_{см} – энергия смещения атомов;

S_{см} -- число смещенных атомов в результате действия иона или электрона;

λ_{ср і,е} – средняя линейная длина свободного пробега ионов и электронов

в материале мишени;

W(x, y, z, t)-энергия деформирования единичного объема мишени;

m_a – масса диффундирующего атома;

 $C_a[T_a]$ – теплоемкость диффундирующего материала при температуре Та;

 $P_{T.X}(n_A, n_B, T, t_{B3})$ – вероятность термохимической реакции, зависящая от концентрации реагентов n_A и n_B , температуры T и времени взаимодействия t_{B3} ;

 n_A и n_B – концентрация реагента, определяющего возможность реакции; $\rho[T]_{(r)}$ – удельное электрическое сопротивление при температуре T;

j(x, y, z, t) – плотность тока с учетом растекания тока.

W_{кр} - энергия кристаллизации.

Энергию деформирования единичного объема определим как:

$$W = G \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx}^{2} + \varepsilon_{yy}^{2} + \varepsilon_{zz}^{2} + 2(\varepsilon_{xy}^{2} + \varepsilon_{yz}^{2} + \varepsilon_{zx}^{2}) + \\ + \frac{\mu}{1 - \mu} \ell^{2} - \frac{2(1 + \mu)\alpha_{1}}{1 - 2\mu} \ell(T(x, y, z, t) - T) \end{bmatrix},$$
(2)

где $2\varepsilon_{ik} = 2\varepsilon_{ki} = \frac{\partial u_k}{\partial i} + \frac{\partial u_i}{\partial k}$ (k, i = x, y, z); $\ell = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$,

 $\epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz} - удлинения;$

 $\epsilon_{xy}, \epsilon_{yz}, \epsilon_{zx}$ – сдвиги относительно соответствующих осей;

u_x, u_y, u_z – перемещение относительно соответствующих осей;

α_! – коэффициент линейного расширения материала мишени;

μ – коэффициент Пуассона (отношение поперечной деформации к продольной, значения μ заключены между 0 и 0,5);

G – модуль сдвига (модуль второго рода);

Tн – начальная температура. Для железа G = 3,5...5,3·10¹⁰ H/м², μ = 0,23...0,31.

Деформация сдвигов є_{ік} не могут задаваться произвольно, они связаны дифференциальными соотношениями - условиями совместности:

$$\frac{\partial^{2} \varepsilon_{xx}}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} \varepsilon_{yy}}{\partial x^{2}} = 2 \frac{\partial^{2} \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}; \quad \frac{\partial^{2} \varepsilon_{xx}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-\frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} \right]$$

$$\frac{\partial^{2} \varepsilon_{yy}}{\partial z^{2}} + \frac{\partial^{2} \varepsilon_{zz}}{\partial y^{2}} = 2 \frac{\partial^{2} \varepsilon_{xy}}{\partial z \partial y}; \quad \frac{\partial^{2} \varepsilon_{yy}}{xy \partial z} = \frac{\partial}{\partial y} \left[-\frac{\partial \varepsilon_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} \right]$$

$$\frac{\partial^{2} \varepsilon_{xx}}{\partial z^{2}} + \frac{\partial^{2} \varepsilon_{zz}}{\partial x^{2}} = 2 \frac{\partial^{2} \varepsilon_{zx}}{xz}; \quad \frac{\partial^{2} \varepsilon_{zz}}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial z} \left[-\frac{\partial \varepsilon_{yx}}{\partial z} + \frac{\partial \varepsilon_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \varepsilon_{xz}}{\partial x} \right]$$
(3)

этими условиями проверяется правильность определения удлинений и сдвигов, а их корректировка – вводом дополнительных напряжений.

Для определения удлинений ϵ_{xx} , ϵ_{yy} , ϵ_{zz} и сдвигов ϵ_{xy} , ϵ_{yz} , ϵ_{zx} воспользуемся выражением термоупругого потенциала перемещений Φ .

$$\Delta \Phi - \frac{1 - 2\mu}{2(1 - \mu)} \cdot \frac{\gamma}{G} \cdot \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} =$$

$$= \frac{1 + \mu}{1 - \mu} \cdot \alpha_1 \cdot [T(x, y, z, t) - T_{\cdot}],$$
(4)

где ү – плотность материала мишени.

Учитывая, что решение задачи проводится в подвижной системе координат и при выходе на стационарный или близкий к нему режим, второе слагаемое в левой части уравнения (4) становится незначительным, получим:

$$\Delta \Phi = \frac{1+\mu}{1-\mu} \cdot \alpha_1 \cdot [T(x, y, z, t) - T].$$
(5)

По величине термоупругого потенциала перемещений и по известным соотношениям находим величины удлинений и сдвигов:

$$\varepsilon_{ik} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial i \partial k}, \quad (i, k = x, y, z)$$
 (6)

Величины температурных напряжений определим по выражению:

$$\sigma_{ik} = 2G \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial i \partial k} - \Delta \Phi \cdot \delta_{ik} \right), \tag{7}$$

где δ_{ik} подчиняется условиям: $\delta_{ik} = 0$ при $i \neq k$ (i, k = x, y, z) $\delta_{ik} = 1$ при i = k.

В седьмом слагаемом формулы (1), учитывающем теплоперенос диффундирующим материалом, масса диффундирующего атома определяется как:

$$m_a = M \cdot m_p, \tag{8}$$

где М – атомный вес наносимого материала;

m_p – масса протона.

Изменение концентрации диффундирующих атомов в единицу времени можно при t < t_k определить как:

 $\frac{\mathrm{dn}_{\mathrm{a}}}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{j}}{\mathrm{e} \cdot \mathrm{z} \cdot \sqrt{\alpha \tau}}$

При t ≥ t_к

$$\frac{\mathrm{dn}_{\mathrm{a}}}{\mathrm{dt}} = \frac{\mathrm{j}}{\mathrm{e} \cdot \mathrm{z} \cdot \mathrm{L}_{\mathrm{D}}},\tag{9}$$

где ј – плотность тока;

е – заряд электрона;

z – зарядовое число наносимого материала;

L_D – толщина детали;

 t_k – время, за которое деталь прогреется на всю толщину, $t_k = L_D^2/\alpha$;

α – коэффициент температуропроводности.

Формула для расчета коэффициента диффузии:

$$K_{\mu\mu\phi} = a_d \cdot d_{\theta}^2 \cdot V_0 \cdot exp(-U/(kT))$$
(10)

......

где а_d – множитель порядка 0,1, определяемый типом кристаллической решетки;

d_э – расстояние между ближайшими эквивалентными положениями вакансий в кристалле;

 V_0 – величина порядка частоты атомных колебаний в кристалле (10¹² – 10¹⁴ с⁻¹);

U – потенциальный барьер, который необходимо преодолеть вакансии при смещении в соседнее положение;

k – постоянная Больцмана;

Т – абсолютная температура.

 $q_n(x,\tau)$ – объемная плотность теплового потока излучения на расстоянии (o,l, δ) за время износа τ , $\delta = 10^{-5} \div 10^{-4}$ – толщина слоя, в котором поглощается энергия ионизирующего излучения, 1-R – поглощательная и α – коэффициент поглощения.

1.2. Теплообмен на поверхности детали

Тепловой поток на поверхности мишени создается за счет:

процессов: 1. Столкновительных тепла, выделяемого на действия поверхности вследствие электрона или иона (первое слагаемое отводится тепловой поток распыленными справа). С частицами (третье слагаемое), С термоэлектронами (четвертое слагаемое), для ионов - отводится тепловой поток с ионно-ионной вторичной эмиссией или ионной эмиссией (пятое слагаемое), потенциальной ионно-электронной эмиссией (шестое слагаемое), ионно-электронной кинетической эмиссией (седьмое слагаемое), характеристическим рентгеновским излучением (восьмое слагаемое), тормозным рентгеновским излучением слагаемое), (девятое переходным излучением (десятое слагаемое), электронов для осуществляется теплоотвод с вторичными электронами (одиннадцатое с вторичными фотонами (двенадцатое слагаемое), с слагаемое), переходным излучением Черенкова (тринадцатое слагаемое), С излучением (четырнадцатое слагаемое), с тормозным рентгеновским (пятнадцатое слагаемое), характеристическим излучением С рентгеновским излучением (семнадцатое слагаемое).

2. Теплофизических процессов: отводится тепловой поток с испаренным материалом (восемнадцатое слагаемое), с ушедшим материалом в жидкой фазе, если создаются условия для его выброса (девятнадцатое слагаемое), с тепловым излучением нагретой поверхности (двадцатое слагаемое) и с конденсированными атомами, ранее испаренными (двадцать первое слагаемое).

3. Плазмохимических процессов, реализующихся за счет реакций потока плазмы или потока ионов с распыленным и испаренным материалом мишени или с адсорбиро излучением.

Передача энергии также осуществляется за счет излучения потока ионов, электронов или плазмы (последнее слагаемое):

$$-\lambda[T]\frac{\partial T(x, y, z, t)}{\partial x} = F_{i,e} + q(r) - F_{pacn} - F_{M.9.} - -[F_{ee} + F_{e\phi} + F_{u.9} + F_{nu} + F_{x,pu} + F_{mpu} + F_{nu_{-}}]_{e} - [F_{uu,e} + F_{u.9.9} + F_{u.9.9} + F_{x.pu} + F_{mpu} + F_{nu_{-}}]_{i} - F_{ucn} - F_{nn} - \sigma \mathcal{E}T^{*}(0, y, z, t) \pm F_{\kappa ond} + F_{nx} + \sigma \mathcal{E}_{c}T^{*}_{c},$$
(11)

где о – постоянная Стефана-Больцмана;

ε и ε_c – степень черноты поверхности мишени и среды;

T_c – температура среды.

Рассмотрим более подробно каждое слагаемое в формуле (11):

Плотность теплового потока вследствие действия налетающих частиц равна:

$$F_{i,e} = \mu_{i,e} E_{i,e} J_{i,e} - K_{\text{orp } i,e} J_{i,e} E_{\text{orp } i,e}, \qquad (12),$$

где $\mu_{i,e}$ — коэффициент аккомодации иона или электрона, определяющий максимальную долю энергии, которую ион или электрон может передать атому;

Е_{і.е} – энергия налетающих частиц;

К_{отр і,е} – коэффициент отражения ионов или электронов;

Еотр і,е – энергия отраженных частиц.

Кнудсен определили коэффициент аккомодации как:

$$\mu = \lim_{E_1 \to E_0} \frac{E_2 - E_0}{E_1 - E_0},$$

(13)

где Е_о – энергия налетающей частицы;

Е₁ – энергия атомов на поверхности;

Е₂ – энергия покидающей частицы.

2. Результаты расчета полей температур и температурных напряжений при действии потока плазмы и получение наноструктур

Исследованы теплофизические процессы при действии плазменного потока в широком диапазоне интенсивности потока частиц.

Для индивидуальных частиц (j≤j[°]_{кр}) и потока как сплошной среды (j≤j[°]_{КР}) можно пользоваться результатами, приведенными в [1]. Исследование проведем в основном для случая взаимовлияния соседних частиц (j<j[°]<j[°]_{КР}).

Для индивидуальных частиц (j≤j^{*}_{кр}) и потока как сплошной среды (j≤j^{*}_{КР}) можно пользоваться результатами, приведенными выше. Исследование проведем в основном для случая взаимовлияния соседних частиц (j<j^{*}<j^{*}_{КР}).

1. Рассмотрим три случая теплового действия плазмы на деталь. Действие частиц плазменного потока как индивидуальных тепловых источников, т.е. случай отсутствия наложения температурных полей соседних ионов и электронов (j≤j²кр).

2. Совместное тепловое действие ряда частиц при наложении их температурных полей (j≤j'≤j''_{КР}).

3. Действие плазменного потока как сплошной среды (j≥j"к_Р).

Рассмотрим действие электронов и ионов средних энергий в плазменном потоке при условии, что ј≤ј'ко. Если плотность тока лежит между первой и второй критической, т.е. когда наблюдается наложение полей ОТ действия температурных соседних частиц, задача усложняется. Проанализируем действие только четырех тепловых источников, первые два из которых - это ионы с энергией É_i, а остальные - электроны с энергией É_e (рис. 6), причем в рассматриваемой области выделяется только четвертая часть энергии каждой из четырех частиц. Эта область ограничивается прямоугольным параллелепипедом со сторонами, равными расстоянию между частицами в потоке l_r, и высотой, равной максимальной глубине проникновения температурного поля. Тепловые источники - электроны - действуют в точках А(0, 0, 0) и $C(0, I_r, I_r)$, в точках же $B(0, I_r, 0)$ и $D(0, 0, I_r)$ действуют ионы (вдоль вертикалей, проходящих через эти точки).

В общем случае рассмотрение температурных полей в зоне действия плазменного потока проводилось при плотностях тока, равных критической промежуточных значениях. Такое первой И при рассмотрение позволяет выявить все экстремальные ситуации И правомочность оценить разделения теплофизических задач ПО плотностям тока (интенсивностям) в плазменном потоке.

На рис. 7 представлена картина распределения температур в зоне действия на деталь из железа (стали) плазменного потока с ионами азота (средняя энергия É_i=800 эВ) и электронами (É_e=3 эВ) на следующих поверхностях:

1) x=0; 2) x=0,75 λ_{cp} ; 3) x=1,5 λ_{cp} (где $\lambda_{cp} = 1/2(\lambda_e + \lambda i_i)$ за время $t = \frac{\tau_{bi} + \tau_{be}}{2} = \tau_{bcp}$, t=2 τ_{bcp} , t=10 τ_{bcp} . Плотности тока в плазменном потоке составляли:

j=j'_{кр}=7×10⁶ A/м² (рис.2а); j=8×10⁷ A/м² (рис. 7, б); j=j''_{кр}=0,3×10⁸ A/м² (рис.7, в). Видно, что при малых плотностях тока температурные поля в зоне действия частиц остаются такими же, как при действии иона с энергией 800 эВ и электрона с энергий 3 эВ, максимальная температура наблюдается в зоне действия ионов и составляет величину 2100 К, тогда как в зоне действия электрона температура значительно ниже. На рассмотренных глубинах распределения температур отличаются значительно, наблюдается несколько более высокие температуры на $0,75\lambda_{cp}$. Распределение температур глубине ПО исследованным поверхностям существенно неоднородное.



Рисунок 6 – Дальнейшее увеличение плотности тока до второй критической, приводит к выравниванию распределения температур

8×10⁷ А/м² ДО При потоке увеличении плотности тока В наблюдается наложение температурных полей соседних частиц, характер изменения температур В исследованных плоскостях становится более равномерным. В центральной части рассматриваемых поверхностей величины температур заметно увеличиваются, HO максимальная температура остается такой же, как и в предыдущем случае. Однако и в этом случае градиенты температуры существенны, а характер распределения температуры на исследованных глубинах сохраняется (рис. 7, б).

Дальнейшее увеличение плотности тока до второй критической, приводит к выравниванию распределения температур - они приближаются к максимальным. Не значительный градиент температур наблюдается по диагонали, где действуют электроны (рис. 7, в). Дальнейшее увеличение плотности тока привадит к выравниванию распределения температур по поверхности.

При действии плазменного потока на алюминиевую деталь (É_i=800 эВ, É_e=38 эВ, ионы титана) характер распределения температур по глубине изменяется, наблюдается их различие. Так, при плотности тока, критической (j=j[']кр, a), равной первой рис. 8, просматривается существенная неоднородность температур по глубине мишени и в исследованных плоскостях. Характер распределения в зоне действия частиц такой же, как при действии ионов с энергией 800 эΒ (максимальная температура 637 К наблюдается на глубинах x=0,6λ_{cp} для ионов). Реализуются значительные градиенты температур. При увеличение плотности тока в пучке до 3×10⁷ А/м² (рис. 8, б) происходит некоторое их выравнивание в исследованных плоскостях, максимальная температура и немонотонность ее по глубине сохраняются, градиенты падают по сравнению с предыдущими случаями.



Рисунок 7 – Температурные поля в зоне действия плазменного потока на железо $/E_{cp}$ = 8009B, Ecp_l = 39B/ при различных плотностях тока: a - j = j^l_{kp} =7.10⁶ A/m²; б - j = 8.10⁷ A/m²; в - j^{ll}_{kp} = 3,3 ·10⁸ A/m² (T_{max}=2,1.10³ К ионы азота)

Дальнейшее увеличение плотности тока до второй критической (2,1×10⁸ Ам², рис. 8, в) приводит к выравниванию распределения температур в исследованных плоскостях и приближению их к максимальной в диагональной плоскости действия электронов. Таким образом, увеличение плотности тока приводит к выравниванию температурных полей. После завершения цикла облучения наблюдается выравнивание температурных полей по поверхностям и некоторый рост температуры в глубине, после чего она снижается.

Исследование полей температур показало наличие высоких по градиентов температур, ЧТО говорит величине 0 возможности реализации температурных напряжений значительных по величине. Результаты расчета температурных напряжений представлены на рис. 9 и 10. Так для случая действия плазменного потока с ионами азота E_i=800 эΒ И E_e=3 эВ на железо реализуются максимальные температурные напряжения 1,4[.]10⁹ Н/м² на глубине 0,6 Х_{ср} при плотности тока равной первой критической (7·10⁶ A/м²) с ростом плотности тока происходит снижение при плотностях тока j=8·10⁶ и становятся совсем незначительными при плотностях токов равных второй критической j=6,3·10⁸ A/м². Причем для первой критической плотной тока температурные напряжения на поверхности достигают значений 5,7^{10⁸} H/м², которые с ростом плотности тока снижаются (рис. 9).



Рисунок 8 – Температурные поля на поверхностях X=0, X=0, δ_{cp} и X=1,2 λ_{cp} в зоне действия плазменного потока E_i = 800эВ - Ти, E_e = 3,8эВ с плотностью токов: a - j = j^I_{kp} =2,7[.]10⁶ A/m²;6 - j = 3[.]10⁷ A/m²; в - j = j^{II}_{kp} = 3,7[.] 10⁷ A/m² на алюминиевую мишень.T_{max} = 637 К

В случае действия плазменного потока с ионами титана E_i=800 эВ и электронами, E_e=3 эВ на алюминиевую деталь при плотности тока $=2.7 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$ равной первой критической плотности тока (j'_{кр} максимальные значения темпераурных напряжений реализуются на глубине равной 0,6 λ_{ср} и равны 5,4·10⁸ Н/м² в тоже время на поверхности и на глубине авной 1,2 Хср они малы. С ростом плотности тока до второй критической ($j_{\kappa p}^{\parallel} = 2,1 \ 10^8 \ A/m^2$) они существенно снжаются даже на глубине X = 0,6X_{ср}. В этом случае температурные напряжения на поверхности и на глубине равнй 1,2 Хср незначительны, что связано с теплофизическими и механическими характеристиками обрабатываемой детали (рис. 10).

Интегральное действие плазменного быть потока может рассмотрено как для случая действия потока частиц как сплошной среды [1] но там динамика температур и температурных напряжений существенно незначительна И высоких значений температур И температурных напряжений ожидать не следует, а тем более высоких скоростей нарастания температур.



Рисунок 9 – Температурные напряжения в зоне действия плазменного потока на железо (сталь): $E_i = 800$ B, Ee = 3 B, $\sigma_{np} = 1.4 \ 10^9 \text{H/m}^2/\text{ a - } j = j^I_{kp} = 7.10^6 \text{ A/m}^2$; $6 - j = 8.10^7 \text{ A/m}^2$; $B - j^{II}_{kp} = 6.3.10^8 \text{ A/m}^2$



Рисунок 10 – Поля температурных напряжений в зоне действия плазменного потока на молибден / E_{cp} 0 800эВ, Ecp_l = 3эВ/ при различных плотностью тока: a - j = j_{kp}^{l} =2,7[·]10⁶ A/m²; б - j = 3[·]10⁷ A/m²; в - j_{Ilkp} = 2,1 ·10⁸ A/m², σ_{max} = 5,4[·]10⁸ H/m²

Выводы

Показано, что достигаются требуемые температуры и скорости нарастания температур, величины температурных напряжений (давлений) достаточные для получения наноструктур в объеме детали, в то же время для повышения эффективности этого процесса можно подавать в плазменном потоке небольшую долю ионов катализатора.

Список использованных источников

1. Костюк Г.И. Физические процессы плазменно-ионных, ионнолучевых, плазменных, светолучевых и комбинированных технологий. Физико-технические основы нанесения покрытий, ионной имплантации и ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированных технологий: моногр. / Г.И. Костюк. – К.: Изд-во АИНУ, 2002. – Кн. 1. – 587 с.

2. Костюк Г.И. Физико-технические основы напыления покрытий, ионной имплантации и ионного легирования, лазерной обработки и упрочнения, комбинированной технологии. Справочник для расчета физических технологических параметров, ОСНОВНЫХ И оценки возможностей, выбора типа технологий и оборудования. Физикотехнические основы нанесения покрытий, ионной имплантации и легирования, лазерной обработки ионного И упрочнения, комбинированных технологий: моногр. / Г.И. Костюк. – К.: Изд-во АИНУ, 2002. – Кн. 2. – 441 с.

3. Костюк Г.И. Эффективный режущий инструмент с покрытием и упрочненным слоем: справ. / Г.И. Костюк. – К.: Изд-во АИНУ, 2003. – 414 с.

4. Костюк Г.И. Наноструктуры на базе фуллеренов: Физика, свойства, применение / Г.И. Костюк // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 3(50). – Х., 2007. – С. 78 – 96.

5. Костюк Г.И. Об аномально высокой микротвердости слоев из одно- и многокомпонентных покрытий из нитридов, карбидов и карбонитридов металлов / Г.И. Костюк, Л.В. Лобанова, И.А. Сыпченко, А.Н. Куринный // Вісті Академії інженерних наук України: Науковотехнічний та громадський часопис Президії Академії інженерних наук України. – Вип.3 (30). – Київ, 2006. – С. 222 – 231.

6. Костюк Г.И. Трибологические свойства алмазоподобных углеродных покрытий и возможные области их применения / Г.И. Костюк, И.А. Сыпченко // Вісті Академії інженерних наук України: Науковотехнічний та громадський часопис Президії Академії інженерних наук України. – Вип.3 (30). – Київ, 2006. – С. 251 – 259. 7. Костюк Г.И. Научные основы создания современных технологий: учеб. пособие / Г.И. Костюк. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т, 2008. – 551 с.

8. Костюк Г.И. Физико-технические основы роботизированного производства / Г.И. Костюк. – Х.: Харьк. авиац. ин-т, 2006. – 614 с.

9. Гречихин Л.И. Физика наночастиц и нанотехнологий / Л.И. Гречихин. – Минск: УП «Технопринт», 2004. – 397 с.

10. Kostyuk G.I. The effective cutting tools having the coating and hardened layers: monograph-reference book / G.I. Kostyuk. – Kharkov: "KHAI", 2007. – 633 p.

11. Шнейдер П. Инженерные проблемы теплопроводности / П. Шнейдер. – М.: Иностр. лит-ра, 1960. – 488 с.

12. Аксенов И.И. Вакуумная дуга в эрозионных источниках плазмы / И.И. Аксенов. – Изд-во НИИ «ХФТИ», Х., 2005. – 211 с.

13. Хаякава С. Физика космических лучей. Кн. 2.: Ядернофизический аспект / С. Хаякава. – М.: Мир, 1973. – 701 с.

14. Готт Ю.В. Взаимодействие частиц с веществом в плазменных исследованиях / Ю.В. Готт. – М.: Атомиздат, 1978. – 271 с.

15. Гусев А.И. Нанокристаллические материалы: методы получения и свойства / Изд-во РАН, Уральское отделение, Екатеринбург, 1998. – 302 с.

16. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев. – М.: «Физматлит»2005, 416 с.

17. Решетняк Е.Н. Синтез упрочняющих наноструктурных покрытий / Е.Н. Решетняк, В.И. Стрельницкий // Вопросы атомной науки и техники, 2008. – №2. – С. 119 – 130.

18. Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепция и современные проблемы / Р.А. Андриевский // Физика металлов и металловедение, 2003. – Т. 91. – № 1. – С. 50 – 56.

19. Гончаров А.А. Состав, структура и свойства наноструктурных пленок боридов тантала / А.А. Гончаренко, П.И. Игнатенко, В.В. Петухов, В.А. Коновалов и др. // ЖТФ, 2006. – Т. 76.